

## 解析諸元

計算方法:FDTD セルサイズ:0.2 mm<sup>3</sup> タイムステップ:0.3813181 ps 繰返し総ステップ数:16384回 (= 2<sup>14</sup>)

#### ガウスパルスパラメータ:

f\_3dB:15 GHz t0=0.646/f\_3dB la=(1/0.29/t0)<sup>2</sup>

基板:W×D×L = 23.6×1.6×50 mm 基板誘電率: ε'-jε" = 6.9 - j0 ストリップ導体:W×D×L = 2.2×0×50 mm 線路インピーダンス:Z<sub>0</sub> = 50 Ω 誘電体棒:W×D×L = 2.6×1.6×2.6 mm 誘電体棒誘電率: ε'-jε" = 23 - j0

# 出力ファイル

#### FDTD実行時

bc\_xy: xy断面(z=25mm)の媒質ID Strip conduct bc vz: vz断面(ストリップ導体中心)の媒質ID Dielectric substrate Ground plane bc\_zx: zx断面(基板中央)の媒質ID (Er=6.9) Current source initialdata: 計算パラメータの確認 fort.8: A点のEy時系列データ Dielectric rod (E r=23.0) 10.8 fort.9: B点のEv時系列データ B Unit [mm]

6

#### FFT実行時

5

fort.50: FFT計算パラメータの確認 readdata: 外挿後の時系列データを複素数に拡張したもの spectrum: 振幅周波数スペクトルの絶対値

### 計算結果の妥当性(参考)

#### 透過特性は文献測定値(\*印)と良好に一致した



和田, 沖本, 橋本, 高橋, ``誘電体基板内部に棒状誘電体を周期的に配置したLTCCマイクロストリップ線,路の帯域阻止特性,'' 電子情報通信学会論文誌, Vol.J88-C, No.7, pp.528-534, (2005)